

ПОЛЯРИСКОП

Н. Б. Баранова, Б. Я. Зельмович

УДК 535.5II

Обсуждается возможность создания устройства, позволяющего визуально или фотографически определять состояние произвольной эллиптической поляризации света. Устройство не содержит движущихся элементов типа компенсаторов и поэтому применимо для анализа поляризации сколь угодно коротких импульсов света.

Для описания состояния поляризации излучения (интегральных характеристик - для импульсного или средних по времени характеристик - для непрерывного) обычно используются 4 параметра Стокса. Из них нулевой параметр I_0 характеризует полную энергию или интенсивность, а три остальных параметра после деления на нулевой образуют так называемый приведенный вектор Стокса $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ из некоторого формально вводимого трехмерного пространства (пространства Пуанкаре). Модуль этого вектора

$$P = \sqrt{\xi^2} = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2} \quad (1)$$

дает степень поляризации P , которая в общем случае частично поляризованного излучения меньше единицы и обращается в единицу только для полностью поляризованного излучения. Формальное определение этих параметров таково. Если знаком $\langle \rangle$ обозначить интегрирование за время импульса (или, для непрерывного излучения - усреднение по времени), и направление распространения выбрать вдоль оси z , то матрица корреляции, составленная из комплексных амплитуд E_x, E_y , равна

$$\begin{pmatrix} \langle E_x^* E_x \rangle & \langle E_x^* E_y \rangle \\ \langle E_y^* E_x \rangle & \langle E_y^* E_y \rangle \end{pmatrix} = \\ = \frac{1}{2} I_0 \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \xi_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \xi_2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \xi_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right]. \quad (2)$$

Как известно, для определения четырех параметров I_0 , ξ_1 , ξ_2 , ξ_3 достаточно результатов четырех измерений, например, следующих: полной энергии B_0 ; энергии B_1 , пропущенной поляризатором под углом 45° к осям x и y ; энергии B_2 , пропущенной правым круговым поляризатором, и энергии B_3 , пропущенной поляризатором вдоль оси x :

$$B_0 = I_0, \quad B_1 = 0,5 \quad I_0(1 + \xi_1), \quad B_2 = 0,5 \quad I_0(1 + \xi_2), \\ B_3 = 0,5 \quad I_0(1 + \xi_3). \quad (3)$$

Найдение состояния поляризации (вектора $\vec{\xi}$) требует решения системы (3), однако из-за необходимости проведения вычислений (в особенности нелинейной операции – деления на B_0) этот метод теряет в наглядности, а в случае фотографической регистрации – и в точности.

В настоящем сообщении обсуждается возможность создания чисто оптического устройства (без вычислительных элементов), позволяющего непосредственно регистрировать ориентацию вектора Стокса $\vec{\xi}$. С этой целью представим себе (см. рис. I) плоский поляроид 3, лежащий в плоскости (x, y) и пропускающий свет с электрическим вектором вдоль x . Пусть коллимированный световой пучок 1, распространяющийся от источника к прибору в направлении оси z , перед попаданием на поляроид проходит через тонкий слой двупреломляющего вещества 2. Предположим также, что ось двупреломления лежит в плоскости x, y , а угол α , составляемый осью с направлением x (пропускаемым поляроидом), непрерывно и по определенному закону зависит от положения точки в плоскости x, y , т.е. $\alpha = \alpha(x, y)$. На рисунке Iб пунктирными линиями показана возможная картина переменного (в плоскости x, y) направления оси двупреломления. Пусть к тому же вносимая веществом разность фаз 2Δ для двух ортогональных поляризаций тоже непрерывно и по определенному закону зависит от положения точки: $\Delta = \Delta(x, y)$, (см. рис. Ia). Тогда, при падении на такое устройство светового пучка с одной и той же по всему поперечному сечению интенсивностью и вектором Стокса $\vec{\xi}$ промедленная интенсивность дается выражением

$$B(x, y) = (1/2)I_0[1 + (\vec{\eta}(x, y)\vec{\xi})], \quad (4a)$$

где зависящий от (x, y) единичный трехмерный вектор $\vec{\eta}$ имеет компоненты

$$\begin{aligned}\eta_1(x, y) &= 2 \sin^2 \Delta \sin 2\alpha \cos 2\alpha \\ \eta_2(x, y) &= 2 \cos \Delta \sin \alpha \sin 2\alpha \\ \eta_3(x, y) &= 1 - 2 \sin^2 \Delta \sin^2 2\alpha.\end{aligned}\quad (4a)$$

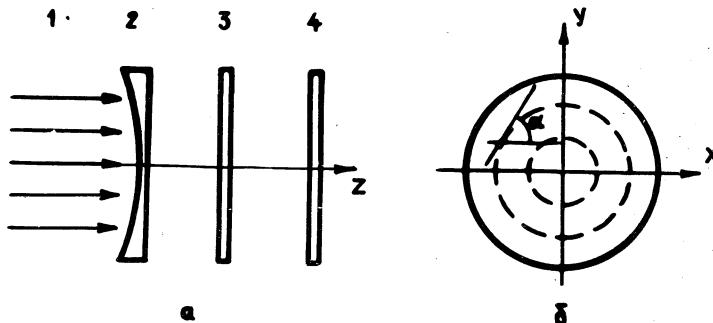


Рис. I. Схема полярископа: а) вид сбоку; б) вид со стороны источника

из (4а) следует, что максимум и минимум пропущенной интенсивности достигаются там, где вектор $\vec{\eta}(x, y)$ соответственно параллелен или антипараллелен направлению вектора Стокса \vec{S} исследуемого излучения. Визуальное или фотографическое определение положения этого максимума (или минимума) однозначно указывают на направление вектора Стокса.

На поверхность прибора можно нанести отсчетную сетку в плоскости x, y . Градиуровочные измерения для нанесения такой сетки могут быть основаны на следующем обстоятельстве. Единичный вектор $\vec{\eta}(x, y)$ просто связан с вектором Стокса $\vec{v}(x, y)$, характеризующим состояние поляризации света, пропускаемого системой в обратном направлении – от поляризатора через двупреломляющий слой:

$$\eta_1(x, y) = v_1(x, y), \eta_2(x, y) = -v_2(x, y), \eta_3(x, y) = v_3(x, y). \quad (4b)$$

Отметим, что определение глазом или прибором положения максимума

и интенсивности есть процедура, нелинейная по интенсивности излучения. Таким образом, в смысле формальной теории когерентности нам не удалось избежать использования высших по интенсивности моментов. Грубая визуальная или точная фотографическая регистрация контраста картины позволяет определить и степень поляризации Р:

$$P = (I_{\max} - I_{\min}) / (I_{\max} + I_{\min}). \quad (5)$$

В частности, как обычно, полностью поляризованному свету соответствует погасание интенсивности до нуля в некоторой точке плоскости x,y.

Мы хотим обратить внимание в настоящей заметке на то, что существует достаточно реалистичная возможность создания двупреломляющих слоев с требуемыми свойствами. Именно, жидкые кристаллы являются средами с переменным в пространстве направлением оптической оси. Более того, как известно, это направление можно (на не слишком большом удалении, ≤ 20 мкм от поверхности) задать с помощью предварительного натирания этой поверхности определенным способом. Наконец, величина двупреломления в типичных жидких кристаллах весьма велика: $|n_o - n_e| \sim 0,2$, так что для видимого света достаточно весьма умеренных (~ 2 мкм) вариаций толщины слоя.

Существуют, по-видимому, и другие способы создания двупреломляющего слоя, которые мы здесь не обсуждаем.

Предполагаемый способ соответствует регистрации большого количества избыточной информации: вместо четырех независимых величин B_0, B_1, B_2, B_3 измеряется функция $B(x, y)$ двух непрерывных параметров x, y . В этой связи практическая чувствительность такого способа должна быть ниже, чем у четырехточечного. Мы надеемся, тем не менее, что в некоторых случаях преимущество, связанное с наглядностью, может оказаться решающим.

Поступила в редакцию
7 февраля 1977 г.